

## LED單晶封裝用大功率測試機

## 測試LED一般電性和光學

型號：ZCLED-16A08\N

測試項目	量測規格				輸出項目	輸出規格				備註	
	單位	範圍	精度	重複性		單位	範圍	精度	輸出時間		
VF	V	0.1~80.00	±0.25%+0.02	±0.1	IF	mA	0.001~4.000	±1%+0.002	2~99mS	1.2.8	
							4.01~40.00	±1%+0.02	0.3~99mS		
							40.1~400.0	±1%+0.2	0.3~99mS		
							401~6000	±1%+2	0.3~99mS		
DVF	V	0.1~80.00	±0.25%+0.02	±0.1	DIF	mA	0.001~4.000	±1%+0.002	2~99mS	1.2.8	
							4.01~40.00	±1%+0.02	0.3~99mS		
							40.1~400.0	±1%+0.2	0.3~99mS		
							401~6000	±1%+2	0.3~99mS		
POLA	分辨極性，無讀值顯示				POL A IF	mA	4.01~400.0	±1%+0.2	1mS		
HEAT	加熱材料，無讀值顯示				HEAT IF	mA	0.001~4.000	±1%+0.002	2~99mS	1.2.8	
							4.01~40.00	±1%+0.02	0.3~99mS		
							40.1~400.0	±1%+0.2	0.3~99mS		
							401~6000	±1%+2	0.3~99mS		
VFD	V	0.1~80.00	大約值	±0.1	IFD	uA	100uA	大約值		1.2.8	
						mA	25mA				
VZ	V	0.1~800.0	±0.5%+0.2	±0.4	IZ	uA	10.00~40.00	±1%+0.02	2~99mS	1.2.8	
							40.1~400.0	±1%+0.2	2~99mS		
							401~1000	±1%+2	2~99mS		
LOP (Iv或Ie)			0.01~4.000	±2%	±1%	LOP IF	mA	0.001~4.000	±1%+0.002	2~99mS	1.3.8
			4.01~40.00	±2%	±1%			4.01~40.00	±1%+0.02	0.3~99mS	
			40.1~400.0	±2%	±1%			40.1~400.0	±1%+0.2	0.3~99mS	
			使用校正方式可對應到(Iv或Ie)					401~6000	±1%+2	0.3~99mS	
λd	nm	380.0~700.0	±0.5nm	±0.3nm	spec IF	mA	0.001~4.000	±1%+0.002	2~99mS	4.6.5.7.8	
λc	nm	380.0~720.0	±0.5nm	±0.3nm			4.01~40.00	±1%+0.02	0.2~99mS		
λp	nm	380.0~1000.0	±0.5nm	±0.3nm			40.1~400.0	±1%+0.2	0.2~99mS		
HW	nm	3.0~600.0nm	±0.5nm	±0.3nm			401~6000	±1%+2	0.2~99mS		
Purity		0.000~1.000	±0.002	±0.001			CCD為2048pixel，積分時間最低0.2mS				
CIE x.y		0.0002~1.0000	±0.001	±0.0005							
CCT	° K	1000~25000	±100	±50							

- 1.使用一般LED測試結果，請確實排除受熱和環境影響
- 2.S/N比較差時須使用電源濾波方式[50/60HZ]，並且時間要大於50Hz=20mS 60Hz=16.6mS以上
- 3.使用標準件校正LOP並隨波長修正
4. λ d/Purity/CCT 由X.y計算，請參閱x.y的精度和重複性
- 5.過於平頂型LED會造成 λ p跳動過大
- 6.UV波段校正需使用UV標準燈源
7. λ d讀值僅限定在可見光源
- 8.量測輸出電流越小需要根據現場狀況適當增加時間

產品尺寸圖

